# Intelligente Steckverbinder mit integrierten temperaturstabilen hochdielektrischen Keramikfiltern als Interface in Kommunikationsnetzen

## Abschlußbericht

Conec Elektronische Bauelemente GmbH, Lippstadt

PI Ceramic GmbH, Lederhose

Laufzeit des Vorhabens 1.02.2001 bis 31.01.2004

Verfasser :

Jörg Kühle, FA CONEC , Lippstadt Jan Meppelink, Prof. Dr.-Ing, FH-SWF, Soest Albrecht Otto, FA PI CERAMIC, Lederhose Dr. Falko Schlenkrich, IKTS Dresden

Projektleiter : Jörg Kühle

# Dieses Projekt wurde durch das BMBF im Förderprogramm Matech gefördert.

Förderkennzeichen 03N1072

| 1        | AUI         | FGABENSTELLUNG  | 5  |
|----------|-------------|---|----|
| 1.1      | Zi          | elwerte   | 6  |
| 1.2      | V           | oraussetzungen, unter denen das Projekt durchgeführt wurde              | 7  |
| 1.3      | Ρ           | lanung und Ablauf des Vorhabens   | 8  |
| 2<br>PR( | STA<br>DJEI | AND DER WISSENSCHAFT UND TECHNIK ZU BEGINN DES<br>KTS                   | 10 |
| 2.1      | в           | ekannte Konstruktionen  | 16 |
| 2.2      | в           | ekannte Verfahren   | 16 |
| 2.3      | V           | erwendete Fachliteratur und genutzte Informationsdienste                | 18 |
| 3        | zus         | SAMMENARBEIT MIT ANDEREN STELLEN  | 18 |
| 3.1      | Р           | I Ceramic und IKTS  | 18 |
| 3.2      | С           | onec und Uni GH Paderborn / FH-SWF                                      | 18 |
| 4        | ERZ         | ZIELTE ERGEBNISSE   | 19 |
| 4.1      | Α           | us der Zusammenarbeit PI Ceramic und IKTS                               | 19 |
| 4.       | 1.1         | Auswahl von Komponenten   | 20 |
| 4.       | 1.2         | Herstellung von Keramiken unter Verwendung von Glattscherben            | 24 |
|          | 4.1.2       | 2.1 Mischungen von Bleiperowskitpulvern mit Bleiperowskit-Glattscherben | 25 |
|          | 4.1.2       | 2.2 Mischungen von Bariumtitanatpulvern mit Bariumtitanat-Glattscherben | 29 |
| 4.       | 1.3         | Modifikation bekannter X7R-Werkstoffe                                   | 30 |
| 4.       | 1.4         | Skalierung der Heterogenität  | 31 |
| 4.       | 1.5         | Herstellung von Sprüh- und Wirbelschichtgranulaten                      | 33 |
| 4.       | 1.6         | Granulate von Werkstoffen auf Basis komplexer Bleiperowskite            | 35 |
| 4.       | 1.7         | Granulate von Werkstoffen auf Basis BaTiO <sub>3</sub>                  | 39 |
| 4.       | 1.8         | Bleieisentantalat-Keramiken   | 41 |
| 4.       | 1.9         | Reproduktion an Kilogramm-Versätzen                                     | 44 |
| 4.       | 1.10        | Lösungsansatz – Bleioxidhaltige Verbindungen                            | 46 |
| 4.       | 1.11        | Lösungsansatz – Bleioxidhaltige Verbindungen                            | 49 |
| 4.       | 1.12        | Ergebnisse der Wirbelschichtgranulat-Mischungen                         | 50 |
| 4.       | 1.13        | Herstellung und Ergebnisse von Funktionsmustern                         | 52 |
| 4.       | 1.14        | Ergebnisse einer 3-poligen Planarfilter-Ausführung                      | 52 |
| 1        | 1 15        | Ergebnisse am 9-poligen Planarfilter                                    | 53 |

| 4.1.16 Zusammenfassung und Wertung der Ergebnisse                          | 54 |  |  |
|--|----|--|--|
| 4.1.17 Ergebnisse der Sprühgranulatmischungen                              | 55 |  |  |
| 4.1.18 Schlussfolgerungen aus den Ergebnissen                              | 60 |  |  |
| 4.1.19 Ergebnisse beim Einsatz von Bleieisentantalat                       | 60 |  |  |
| 4.1.20 Aktivitäten und Ergebnisse bleifreier Systemen                      | 66 |  |  |
| 4.2 Aus der Zusammenarbeit CONEC und Universität GH Paderborn bzw FH-SWF   | 68 |  |  |
| 4.2.1 Grundprinzip eines Filtersteckverbinders am Beispiel eines C-Filters | 68 |  |  |
| 4.2.2 Vergleich verschiedener Technologien                                 | 71 |  |  |
| 4.2.3 Realer Kondensator mit einem Dielektrikum hoher Dielektrizitätszahl  | 72 |  |  |
| 4.2.4 Ansätze zur Verbesserung des Hochfrequenzverhaltens                  | 75 |  |  |
| 4.3 Ergebnisse aus der Entwicklung bei der Fa CONEC                        | 81 |  |  |
| 4.3.1 Übersicht der Prüfungen  | 81 |  |  |
| 4.3.1.1 Kapazität und Verlustfaktor  | 81 |  |  |
| 4.3.1.2 Isolationswiderstand   | 81 |  |  |
| 4.3.1.3 Einfügungsdämpfung   | 81 |  |  |
| 4.3.1.4 Übersprechen/Crosstalk   | 82 |  |  |
| 4.3.1.5 Spannungsfestigkeit  | 82 |  |  |
| 4.3.1.6 Steckzyklen  | 83 |  |  |
| 4.3.2 Übersicht Proben   | 83 |  |  |
| 4.3.3 Ergebnisse   | 83 |  |  |
| 4.3.3.1 K1+K2  | 83 |  |  |
| 4.3.3.1.1 Elektrodenmaterial : Standard –D-SUB                             | 84 |  |  |
| 4.3.3.1.1.1 Spannungsfestigkeit  | 85 |  |  |
| 4.3.3.1.2 Elektrodenmaterial HD-SUB  | 86 |  |  |
| 4.3.3.1.2.1 Kapazität  | 86 |  |  |
| 4.3.3.1.2.2 Spannungsfestigkeit  | 87 |  |  |
| 4.3.3.2 K1+K3  | 87 |  |  |
| 4.3.3.2.1 Verlustfaktor  | 89 |  |  |
| 4.3.3.2.2 Isolationswiderstand   | 89 |  |  |
| 4.3.3.2.3 Einfügungsdämpfung / Crosstalk                                   | 90 |  |  |
| 4.3.3.2.3.1 Spannungsfestigkeit  | 91 |  |  |
| 4.3.4 Zusammenfassung der Ergebnisse                                       | 91 |  |  |
| SEQUENCE A   | 92 |  |  |
| SEQUENCE F   | 92 |  |  |
| VISUAL/ MECHANICAL EXAMINATION   | 92 |  |  |
| CONTACT RESISTANCE 92  |    |  |  |

| 5   | VERÖFFENTLICHUNGEN            | 96 |
|-----|-------------------------------|----|
|     | 4.3.4.2 Werkstoffsystem K1+K3 | 94 |
|     | 4.3.4.1 Wekkstoffsystem K1+K2 | 93 |
| SEC | QUENCE I                      | 92 |
| VIS | UAL / MECHANICAL EXAMINATION  | 92 |
| TEF | RMINATION GAS TIGHTNESS       | 92 |
| CAI | BLE TERMINATION RESISTANCE    | 92 |
| VIS | UAL / MECHANICAL EXAMINATION  | 92 |
| VIS | UAL / MECHANICAL EXAMINATION  | 92 |
| DIS | SIPATION FACTOR               | 92 |
| MA  | TING / UNMATING FORCE         | 92 |
| VIS | UAL / MECHANICAL EXAMINATION  | 92 |
| DIS | SIPATION FACTOR               | 92 |
| VIS | UAL / MECHANICAL EXAMINATION  | 92 |





Bild 1.1: Typische Bauformen von Filtersteckverbindern der Fa. CONEC.

## 1 Aufgabenstellung

Entwicklung eines neuen, multifunktionalen dielektrischen HDK-Werkstoffs mit definierter Temperaturcharakteristik, der komplexe Bauformen von Kondensatoren für den Einbau in Filtersteckverbindern der Informationstechnik ermöglicht.<sup>1</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Im Originalantrag vom 28.8.2000 ist folgender Wortlaut zu finden:

Entwicklung eines neuen, multifunktionalen dielektrischen HDK Werkstoffs mit definierter Temperaturcharakteristik. Der Werkstoff ermöglicht komplexe Bauformen von Kondensatoren für den Einbau in Filtersteckverbindern der Informationstechnik mit reduziertem Bleioxidgehalt.

# 1.1 Zielwerte

Die Zieldaten wurden im Antrag vom 28.8.2000 formuliert<sup>2</sup>. Im weiteren Ablauf des Projektes wurden die Zielwerte jedoch aufgrund der zwischenzeitlich vorliegenden Ergebnisse korrigiert und vom Projektträger genehmigt.

Dielektrizitätszahl bei Raumtemperatur > 15.000; geändert auf > 7.500

Temperaturbereich -55 Grad Celsius bis 125 Grad Celsius

Kapazitätsänderung im Temperaturbereich +/- 20 %

Mechanische Festigkeit 50 N/mm<sup>2</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zielwerte: Dielektrizitätszahl bei Raumtemperatur > 15000, Temperaturbereich –55 Grad Celsius bis 125 Grad Celsius, Kapazitätsänderung im Temperaturbereich +/- 20 %, Mechanische Festigkeit 50 N/mm<sup>2</sup>, Einsparung von Edelmetallen.

#### 1.2 Voraussetzungen, unter denen das Projekt durchgeführt wurde

Das Projekt wurde als Verbundprojekt mit den Firmen

**Conec GmbH Lippstadt** Hersteller von Filtersteckverbindern der Informationstechnik und Anwender neuer Werkstoffe in Produkten als Projektkoordinator,

und

**PI Ceramic GmbH** Lederhose als Hersteller von Funktionskeramiken und somit als Hersteller der dielektrischen Filter auf Basis der Entwicklungsergebnisse

duchgeführt.

Im Unterauftrag waren beteiligt :

Von Conec:

Universität Gesamthochschule Paderborn, heute Fachhochschule Südwestfalen, Abt. Soest

Von PIC:

**IKTS Dresden** 

## 1.3 Planung und Ablauf des Vorhabens

Das Vorhaben wurde mit drei Meilensteinen und insgesamt acht Arbeitsschritten geplant<sup>3</sup>:

#### Meilensteine

Meilenstein 1

Ermittlung optimaler Zusammensetzungsbereiche mit Erfüllung der Zieldaten

Meilenstein 2

Selektion der Werkstoffe mit "Performance >0.8" der Zielwerte, Abbruch falls diese Daten nicht erreichbar sind

Meilenstein 3

Prototypen sind komplett gemessen und charakterisiert.

#### Liste der Arbeitsschritte

Arbeitsschritt 1

Detaillierte Literatur- und Patentrecherche

Arbeitsschritt 2

Identifizierung aussichtsreicher Werkstoffzusammensetzungen durch Modellrechnung

#### Arbeitsschritt 3

Evaluierung der Werkstoffkonzepte hinsichtlich der elektrischen Materialkenndaten im Labormaßstab

#### Arbeitsschritt 4

Mechanische Charakterisierung von Prüfmustern aus A3

Arbeitsschritt 5

Übertragung der Ergebnisse aus der Labortechnologie zu PI Ceramic, Maßstabsvergrößerung 1 : 10

## Arbeitsschritt 6

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Siehe auch Antrag vom 28.8.2000 III.2 Arbeitsplan

Elektrische und mechanische Werkstoffcharakterisierung am HDK-Steckverbinder

Arbeitsschritt 7

Optimierung ausgewählter Werkstoffe

Arbeitsschritt 8

Designphase bei Conec incl. Messung der Parameter des Prototyps.

Der Projektablauf war vom 01.02.2001 bis 31.01.2004 bei der Antragstellung geplant und wurde bis 30.06.2004 verlängert.

### 2 Stand der Wissenschaft und Technik zu Beginn des Projekts

Im Rahmen des Projektes lag der materialwissenschaftliche Schwerpunkt der Arbeiten auf dem Gebiet der Entwicklung von Werkstoffen, die eine hohe Dielektrizitätskonstante paaren mit einer geringen Änderung derselben im Temperaturbereich von -55°C bis 125°C. Gefordert wurde eine Änderung von ±20% bezogen auf den Wert bei 20°C. Diese Forderung stellt an sich einen physikalischen Widerspruch dar, da Dielektrizitätszahlen > 5.000 an das Phänomen der Ferroelektrizität geknüpft sind. Dabei erfolgt im Bereich der Curietemperatur T<sub>C</sub> die Umwandlung einer polaren ferroelektrischen Phase in eine unpolare kubische, wodurch in einem sehr engen Temperaturbereich auf der Grundlage von Gitterdeformationen sehr hohe DK<sub>max</sub>-Werte auftreten. Im übrigen Temperaturbereich liegen die DK-Werte z.T. deutlich unter diesen bei Tc beobachteten. Die TKc-Kurven - Änderung der Kapazität über der Temperatur - in den Abb. 1 und 2 verdeutlichen diesen Sachverhalt am Beispiel von BaTiO3-basierten Werkstoffen, die reine Ferroelektrika darstellen, und komplexen Bleiperowskiten, die zu den Relaxorwerkstoffen zählen. Im Bereich der Curietemperatur wirken in beiden Strukturen auf der Ebene der Elementarzellen unterschiedliche Mechanismen, die zu den beobachten Unterschieden in den Kurvenformen führen. So sind die BaTiO<sub>3</sub>-basierten Kurven durch hohe bis z.T. extrem hohe DK<sub>max</sub>-Werte bei Tc verbunden mit sehr steilen Flanken der Kurven charakterisiert. Im übrigen Temperaturbereich weisen diese Werkstoffe verhältnismäßig geringe DK-Werte im Bereich um 1.000 auf, was weit unter den im Rahmen des Projektes geforderten Werten liegt.

Die TKc-Kurven von Bleiperowskiten sind dagegen in der Regel nicht durch derartig hohe DK<sub>max</sub>-Werte bei Tc charakterisiert, weisen dafür aber wesentlich flachere Flanken auf, was dazu führt, dass sich die hohen bis sehr hohen DK-Werte über einen wesentlich breiteren Temperaturbereich erstrecken, was für die geforderte Zielstellung von Vorteil sein sollte.



Bild 2.1: Änderung der Kapazität mit der Temperatur (TKc-Kurve) einer Keramik auf Basis BaTiO3



Bild 2.2: Änderung der Kapazität mit der Temperatur (TKc-Kurve) einer Keramik auf Basis komplexer Bleiperowskite



Bild 2.3: Vergleich der TKc-Kurven von Werkstoffen auf Basis BaTiO3 (blaue Kurve) und Bleiperowskiten (rote Kurve)

Die kristallografische Grundstruktur ist für beide Verbindungsklassen die Perowskitstruktur der allgemeinen Zusammensetzung ABO<sub>3</sub>, die damit auch die Grundlage für die Materialentwicklungen im vorliegenden Projekt darstellte.

Da eine einzelne Verbindung nicht die geforderten Materialeigenschaften – hohe DK-Werte über einen weiten Temperaturbereich - in sich vereint, besteht das Ziel der Entwicklung in einer Steuerung der Mischkristallbildung und damit der Einstellung einer definierten Heterogenität in der Keramik, um auf diesem Weg durch die Überlagerung der individuellen Eigenschaften neue integrale Eigenschaftsprofile einzustellen.

Die dafür in Frage kommenden Systeme sind dabei zum einen die sich vom BaTiO<sub>3</sub> ableitenden Verbindungen mit Sintertemperaturen im Bereich von >1.350°C und zum anderen die sogenannten komplexen Bleiperowskite mit der allgemeinen Formel PbB'B''O<sub>3</sub>, die typischerweise Sintertemperaturen zwischen 1.000°C und 1.200°C aufweisen. Aus diesem Grund ist eine getrennte Betrachtung der Systeme erforderlich, auch wenn aus der Literatur Beispiele

bekannt sind, die durch die Kombination von Bleiperowskiten mit BaTiO<sub>3</sub> Werkstoffe mit X7R-Charakteristik ( $\Delta C/C_{20^{\circ}C} = \pm 15\%$ ; Temperaturbereich: -55°C ... 125°C) beschreiben, wobei die bei 20°C erreichten DK-Werten im Bereich um 4.000 liegen. Die Abflachung der DK wird in diesem Fall durch eine Kern-Rand-Struktur ermöglicht. Diese Struktur scheint nach derzeitigem Wissensstand nicht das Potenzial aufzuweisen, um die im Projekt geforderten Daten zu ermöglichen.

Ein weiteres Werkstoffsystem, das DK-Werte in der geforderten Größenordnung aufweist, sind die sogenannten Sperrschichtwerkstoffe, die vor allem in den 80er Jahren sehr intensiv bearbeitet wurden. Dabei handelt es sich um Verbindungen auf Basis BaTiO<sub>3</sub> und vor allem SrTiO<sub>3</sub>, die unter reduzierenden Bedingungen gesintert werden, wodurch es zu einer Reduktion eines Teils des 4-wertigen Titans in der Perowskitstruktur zu 3-wertigem kommt. Dieser Sinterung schließt sich ein zweiter Temperschritt an Luft unter Verwendung von Gläsern an, der durch Reoxidation und Korngrenzendiffusion eine Isolation der halbleitenden Körner bewirkt. Der eigentliche Dipol ist in diesen Keramiken nicht in der Elementarzelle lokalisiert wie bei den klassischen Ferroelektrika, sondern das gesamte Korn wirkt als solcher. Für derartige Keramiken werden DK-Werte bei Raumtemperatur >100.000 beschrieben, ein entscheidender Nachteil solcher Keramiken die wobei aerinae Durchschlagsfestigkeit aufgrund der halbleitenden Körner verbunden mit der geringen Stärke der die Körner umgebenden Isolationsschichten ist, wodurch ein Einsatz in Filtersteckern nicht möglich ist. Ein weiterer schwerwiegender Nachteil ist die aufwendige und vor allem kostenintensive Technologie zur Herstellung von Sperrschichtwerkstoffen.

Bild 2.4 und Bild 2.5 zeigen im Ergebnis einer Literaturauswertung den Zusammenhang zwischen Curietemperatur und  $DK_{max}$  für verschiedene BaTiO<sub>3</sub>-Systeme und PbB'B"O<sub>3</sub>-Verbindungen. Dabei wird deutlich, dass über den gesamten geforderten Temperaturbereich Verbindungen mit sehr hohen  $DK_{max}$ -Werten beschrieben werden, die damit als Ausgangsmaterialien zur Einstellung einer gezielten Heterogenität dienen können. Somit galt es in der

ersten Projektphase den Stand der Literatur mit der am IKTS vorhandenen Technologie zu reproduzieren.



Bild 2.4: Zusammenhang zwischen Curietemperatur und DKmax ausgewählter BaTiO3-Werkstoffe (Literaturauswertung)



Bild 2.5: Zusammenhang zwischen Curietemperatur und DKmax ausgewählter PbB'B''O3-Werkstoffe (Literaturauswertung)

Aus der Sicht des Anwenders von keramischen Werkstoffen für Kondensatoren ist neben den Temperatureigenschaften besonders das Frequenzverhalten zu berücksichtigen. Die Eigenschaften keramischer Dielektrika sind im Bezug auf ihre Frequenzabhängigkeit in der Literatur beschrieben. Tabelle 2.1 zeigt das typische Verhalten von HDK Materialien, mit einer Dielektrizitätszahl von 5 bis etwa 10000 im Vergleich. Bild 2.6 zeigt die Abhängigkeit von der Frequenz in einer Grafik. Man erkennt, dass es im Bereich hoher Frequenzen um 1-10 GHz zu einer deutlich sichtbaren Veränderung der Eigenschaften kommt. Zu diesen reinen Materialeigenschaften muss noch das Verhalten eines Kondensators als ausgedehntes Bauelement beachtet werden. Wegen der hohen Dielektrizitätszahl ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit in einem Kondensator viel kleiner als die Lichtgeschwindigkeit und es kommt daher auch bei Abmessungen von einigen mm und Frequenzen im GHz-Bereich zu stehenden Wellen im Kondensator.

|          | St                 | eatit Bodies               | Titania and Titanate bodies   |            |   |                 |  |
|----------|--------------------|----------------------------|---|------------|---|-----------------|--|
|          | A                  | SiMag A-35                 | TAN   | A TICON BS | Tam Ticon B   |                 |  |
| Frequenz | ε΄/ε <sub>0</sub>  | ε΄/ε <sub>0</sub> tanδ*1e4 |   | tanδ∗1e4   | ε΄/ε <sub>0</sub>   | tanδ∗1e4        |  |
| 100      | 6,1                | 150                        | 8700  | 230        | 1240  | 360; tand=0,036 |  |
| 1.000    | 5,96               | 100                        | 8500  | 200        | 1200  | 130             |  |
| 10.000   | 5,89               | 70                         | 8200  | 230        | 1170  | 150             |  |
| 100.000  | 5,86               | 50                         | 8100  | 90         | 1153  | 120             |  |
| 1 MHz    | 5,84               | 38                         | 8000  | 48         | 1143  | 105             |  |
| 10 MHz   | 5,8                | 35                         | 8000  | 98         | 1140  | 75              |  |
| 100 MHz  | 5,75               | 37                         | 8000  | 400        | Keine<br>Messdaten  | Keine Messdaten |  |
| 300 MHz  |                    |                            | 7000  | 900        | 1100  | 500             |  |
| 3 GHz    | 5,6                | 41                         | 2000  | 5000       | 600   | 3000            |  |
| 10 GHz   |                    |                            | 200   | 4000       | 150   | 5000            |  |
| 25 GHz   | 5,36               | 58                         |   |            | 100   | 6000; tand=0,6  |  |
|          | Magnesium silikate |                            | 79%Barium 21% Strontium titanate (Titanium Alloy fired at Lab. Ins. Res.) |            | Barium Titanate (Titanium<br>Alloy;fired at Lab Ins.<br>Res.) |                 |  |

Tabelle 2.1: Typisches Verhalten von HDK Materialien<sup>4</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Quelle Arthur von Hippel. Dielectric Materials and Applications; 1954.Reprint 1995, ISBN 0-89006-805-4.



Bild 2.6: Daten aus Tabelle 2.1 als Grafik dargestellt

# 2.1 Bekannte Konstruktionen

Auf dem Markt hat sich eine Vielzahl von Anbietern etabliert, die spezifische Produkte für verschiedenste Anwendungen liefern. Der Frequenzgang der Einfügungsdämpfung liegt jedoch bauartbedingt meist weit hinter der Performance der CONEC-Filter, was durch eine besondere Planartechnik der CONEC Filter bedingt ist. Daher würde ein neuer Werkstoff, verbunden mit dem speziellen Design als Planarfilter einen großen Wettbewerbsvorteil mit sich bringen.

# 2.2 Bekannte Verfahren

Das Dickschichtverfahren für Planarfilter ist seit Jahren bekannt und wird für dieses Produkt angewendet.

Für die Steckerherstellung werden die seit vielen Jahren bewährten Materialien und Spritzgießteile verwendet. Kontakte werden gedreht und vergoldet. Spritzgießteile werden in Kunststoffspritzgießmaschinen hergestellt.

mit

#### Stellen

# 2.3 Verwendete Fachliteratur und genutzte Informationsdienste

Fachliteratur:

Quelle Arthur von Hippel. Dielectric Materials and Applications; 1954.Reprint 1995, ISBN 0-89006-805-4.

## Software

Microcap 7 Spectrum-Soft.com

**Microsoft Office** 

Literatursuche :

Internet

Datenbanken der FH-SWF

## 3 Zusammenarbeit mit anderen Stellen

Die beiden beteiligten Firmen haben sich ihrerseits kompetente Partner aus dem Bereich F+E gesucht, da sie aus eigener Kraft diese Entwicklung nicht leisten können.

# 3.1 PI Ceramic und IKTS

Die Fa. PI CERAMIC hat mit dem IKTS in Dresden ihre langjährigen Kontakte zur Forschung genutzt.

# 3.2 Conec und Uni GH Paderborn / FH-SWF

CONEC hat seine langjährigen Verbindungen zur FH-SWF in Soest genutzt.

# 4 Erzielte Ergebnisse

# 4.1 Aus der Zusammenarbeit PI Ceramic und IKTS

Inhalt der Zusammenarbeit von PI Ceramic und IKTS waren die Lösung der werkstoffwissenschaftlichen Aufgaben und der damit verbundenen technologischen Probleme zur Werkstoffherstellung.

Die Durchführung anspruchsvoller Werkstoffentwicklungen erfordert von allen Beteiligten streng koordiniertes und konzertiertes Arbeiten, um über Suchforschung, Kleinstversatz des Forschungslabors im Gramm-Bereich und Reproduktion im Industrielabor mit Materialmengen von einigen 100 Gramm bis zu wenigen Kilogramm zielgerichtet, effektiv und letztendlich erfolgreich zu agieren. Die große Anzahl unterschiedlicher Versätze ist dabei zusätzlich oft mit Variationen der technologischen Randbedingungen kombiniert, beginnend bei der Pulvervor- und -aufbereitung, über Formgebung, thermische Prozesse bis zur Metallisierung. Die Gefahr, dabei in falsche Richtungen zu gelangen, geplante Zeitachsen weit zu überziehen bis hin zum ungenügenden Erkennen von Trends und Erfolg versprechenden Richtungen, ist nicht unerheblich.

Die im Folgenden beschriebenen Arbeiten und Ergebnisse wurden auf der Basis permanent durchgeführter Konsultationen und Abstimmungen zwischen den Entwicklern des IKTS und von PI Ceramic zu Zielrichtungen, Versatzgrößen, Reproduktionen und dem detaillierten Abgleich aller Ergebnissen erzielt. Im IKTS wurden wenige Tabletten (Standardmaß zur Bemusterung Ø 10 mm x 1,0 mm) aus den gemeinsam festgelegten Werkstoffversätzen gefertigt, teilweise reproduziert und dann bei PI Ceramic in Kleinversätzen wiederholt und z.T. beim IKTS bewertet, bis sich Ergebnisse manifestierten.

Zur Erleichterung der Komponentenauswahl wurde ein eigens entwickeltes Rechenprogramm eingesetzt, das auf der Basis von real gemessenen TKc-Kurven bzw. generierten Gauß'schen Glockenkurven die resultierenden TKc-Kurven von Mischungen mehrerer Komponenten errechnen kann unter gleichzeitiger Einbeziehung einer Variation der Anteile der Einzelkomponenten. Die Auswertung koppelt die Höhe der bei Raumtemperatur erreichten DK<sub>20</sub>-Werte mit der Abweichung der Kapazität über einen bestimmbaren Temperaturbereich.

## 4.1.1 Auswahl von Komponenten

Erste Arbeiten zur Synthese von Ausgangsverbindungen konzentrierten sich im Rahmen dieses Projektes auf das System Bleimagnesiumniobat – Bleititanat – Bariumtitanat (PMN-PT-BT), in dem entsprechend einer Arbeit von Syamaprasa et al. Werkstoffe mit DK<sub>20</sub>-Werten >10.000 und sehr flachen Temperaturabhängigkeiten beschrieben werden ( siehe Bild 4.1).



PMG21, (▲) PMG44, (■) PMG80.



Figure 8 TCC versus T plots for stoichiometric and modified PMN-PT-BT samples: ( $\bigcirc$ ) PMG00, ( $\bigoplus$ ) PMG20, ( $\triangle$ ) PMG21, ( $\blacktriangle$ ) PMG44, ( $\blacksquare$ ) PMG80.

Bild 4.1: TKc-Kurven (links) und DeltaC/C20°C-Kurven (rechts) im System PMN-PT-BT nach U. Syamaprasad et al.



Bild 4.2: TKc-Kurven im System PMN-PT-BT, hergestellt nach IKTS – Technologie

Weitere Verbindungen mit für die Anwendung in Filtersteckverbindern viel versprechenden Eigenschaften werden im System Bleieisenniobat – Bleieisenwolframat – Erdalkalikupferwolframat (PFN-PFW-McuW, M: Ca, Ba) im US-Patent 4544644 unter dem Titel "High dielectric constant type ceramic" beschrieben. Das Interessante an diesen Verbindungen besteht in der Kombination einer sehr hohen Dielektrizitätskonstanten bei Raumtemperatur von > 30.000 mit Sintertemperaturen < 1.000°C, woraus sich das Potenzial zur gezielten Einstellung von Heterogenitäten ergeben könnte.

|     | PFN / mol-% | PFW /<br>mol-% | MCW /<br>mol-% | MnO / wt-<br>% | Ts / °C | DKmax  |
|-----|-------------|----------------|----------------|----------------|---------|--------|
| V7  | 85          | 12             | 3 (Ca)         |                | 900     | 29.500 |
| V24 | 85          | 12             | 3 (Ca)         | 0,25           | 900     | 32.500 |
| V44 | 80          | 18             | 2 (Ba)         |                | 900     | 33.000 |
| V61 | 80          | 18             | 2 (Ba)         | 0,25           | 900     | 34.000 |

| Tabelle 4.2: | Überblick  | über | in | der | Patentschrift | beschriebene | Versätze | mit |
|--------------|------------|------|----|-----|---------------|--------------|----------|-----|
| be           | esonders h |      |    |     |               |              |          |     |

Die eigenen Keramiken auf dieser Werkstoffbasis konnten die genannten Werte nicht in vollem Umfang bestätigen (vgl.Bild 4.3), dennoch ist der Einsatz dieser Verbindungen als niedrig sinternde Komponenten in Mischsystemen geplant.



Bild 4.3: Übersicht über DKmax-Werte für PFN-PFW-MCuW – Keramiken, hergestellt nach IKTS-Technologie

Verbindungen der allgemeinen Zusammensetzung BaTiSnZrO<sub>3</sub> (BTSZ) ermöglichen über eine Variation des Ti / Sn / Zr – Verhältnisses eine Verschiebung der Curietemperatur von 125°C beginnend für reines BaTiO<sub>3</sub> zu niedrigeren Temperaturen. Interessanterweise ist diese Erniedrigung von Tc verbunden mit einem deutlichen Anstieg der DK<sub>max</sub> – Werte. Diese Werte sind wiederum stark von der Synthese der Verbindungen abhängig, wie die Kurven in Bild 4.4 und 4.5 verdeutlichen. Einen deutlichen Vorteil bringt die Totalsynthese. An derartig zusammengesetzten Keramiken konnten DK<sub>max</sub> bis 50.000 gemessen werden.



Bild 4.4: TKc-Kurven von BaTiSnZrO3 synthetisiert unter Verwendung von vorgebildetem BaTiO3



Bild 4.5: TKc-Kurven von BaTiSnZrO3 synthetisiert als Totalsynthese

Neben der Auswahl von vorgebildeten Komponenten kommt auch der Rohstoffqualität eine immense Bedeutung bei der Einstellung gewünschter Eigenschaftsprofile zu. Nach Bestätigung der Literaturwerte bestand deshalb eine Aufgabe darin, den Einfluss unterschiedlicher, industriell verfügbarer BaCO<sub>3</sub> – Pulver auf die dielektrischen Eigenschaften zu untersuchen.

#### 4.1.2 Herstellung von Keramiken unter Verwendung von Glattscherben

Ein wesentlicher Schwerpunkt der weiteren Arbeit bestand in der Herstellung und Charakterisierung der Eigenschaften von Glattscherben und von Mischungen, hergestellt unter Verwendung derartiger Glattscherben.



## 4.1.2.1 Mischungen von Bleiperowskitpulvern mit Bleiperowskit-Glattscherben

Bild 4.6: TKc-Kurven von Bleiperowskit-Keramiken, hergestellt aus Mischungen von Glattscherben und Pulvern (gelbe und türkisfarbene Kurve) im Vergleich zu den TKc-Kurven der reinen Verbindungen (blau, pink).



Bild 4.7: TKc-Kurven von Bleiperowskit-Keramiken, hergestellt aus Mischungen von Glattscherben und Pulvern in Abhängigkeit von der Größe der Glattscherben



Bild 4.8: TKc-Kurven von Bleiperowskit-Keramiken, hergestellt aus Mischungen von Glattscherben und Pulvern in Abhängigkeit von der Größe der Glattscherben im Vergleich zu einer aus einem Pulver hergestellten Keramik

**TKc-Kurven** Aus lassen sich folgende prinzipielle Aussagen zum Reaktionsverlauf Pulvermischungen in ableiten: Jede individuelle Curietemperatur steht für die Umwandlung einer ferroelektrischen in eine paraelektrische Phase, d.h. immer wenn in einem Kurvenzug mehrere Maxima auftreten, sind diese an Phasenumwandlungen gebunden. Liegen nun in einer Keramik mehrere Phasen mit sich unterscheidenden Elementarzellen nebeneinander vor, müssen in den TKc-Kurven dieser Keramik mehrere Maxima auftreten. Hat sich dagegen nach der Sinterung in der Keramik eine neue Verbindung gebildet, weist diese einen neuen Phasenübergang und damit eine neue Curietemperatur auf.

Bei der Suche nach den Ursachen für das Nichtauftreten der Glattscherben in den Mischungen wurden sowohl Untersuchungen zum Einfluss der Größe der eingesetzten Glattscherben als auch zur Art und Dauer der Mischung der Glattscherben mit den Pulvern unternommen.

Eine Erklärung für das Nichtauftreten der Glattscherben in den Mischungen könnte im Gefüge derartiger Keramiken liegen. Aus diesem Grund wurden sowohl Bruchflächen als auch Schliffbilder angefertigt und charakterisiert. Die **REM-Bilder** Bild 4.9 bis Bild 4.10 zeigen einen deutlichen Korngrößenunterschied aufgrund der unterschiedlichen Primärkorngrößen der Ausgangsmaterialien, sie zeigen aber auch gleichzeitig, dass die Porosität in allen Fällen vergleichbar ist und damit nicht als Ursache für den Abfall der dielektrischen Eigenschaften herangezogen werden kann.



Bild 4.9: Bruchfläche einer PMN-PNN-PT-Keramik, hergestellt aus Pulver



Bild 4.10: Bruchfläche einer PMN-PNN-PT-Keramik, hergestellt aus Glattscherben

## 4.1.2.2 Mischungen von Bariumtitanatpulvern mit Bariumtitanat-Glattscherben

Analoge Versuche an BaTiO<sub>3</sub>-basierten Werkstoffen ergaben ein anderes Bild. Danach zeigten die aus den entsprechenden Glattscherben hergestellten Keramiken annähernd das Potenzial der analogen Keramiken aus Pulvern.



Bild 4.11: TKc-Kurven von BaTiO<sub>3</sub>-Keramiken, hergestellt aus Pulvern und Glattscherben



Bild 4.12: TKc-Kurven von BaTiO3-Keramiken, hergestellt aus Pulvern und Glattscherben

#### 4.1.3 Modifikation bekannter X7R-Werkstoffe

Ein weiteres Teilgebiet der Arbeiten befasste sich mit der Modifikation bekannter X7R-Werkstoffe durch den Einsatz von unterschiedlichen PZT-Zusammensetzungen und verschiedenen BaTiO<sub>3</sub>-Komponenten. Bei diesen Untersuchungen konnten zwar Werkstoffe mit abgeflachten TKc-Kurven erhalten werden, die Höhe der erreichten DK<sub>20</sub>-Werte lag dabei allerdings weit unter den geforderten Projektzielen, so dass auch diese Arbeiten nicht zum gewünschten Erfolg führten und nicht weiter verfolgt wurden.

# Werkstoff 1 Werkstoff 2

# 4.1.4 Skalierung der Heterogenität

Bild 4.13: Prinzipskizze zur Skalierung der Heterogenität durch Zusammenbringen zweier unterschiedlich zusammengesetzter Werkstoffe

Nach diesen zuvor erzielten Zwischenergebnissen wurde versucht, durch eine Skalierung der Heterogenität eine Verbreiterung der TKc-Kurven zu erzielen. Aus der Literatur ist bekannt, dass durch das Zusammenfügen von in Folienform vorliegenden Werkstoffen unterschiedlicher Zusammensetzungen derartige Resultate erzielbar sind. Im vorliegenden Fall wurden in ersten Experimenten Presslinge gefertigt, in denen die unterschiedlichen Phasen räumlich getrennt vorlagen, wie schematisch in Bild 4.13 dargestellt ist. Die anschließende Sinterung erfolgte unter Erhalt des Verbundes. Kontaktiert wurden die Ober- und Unterseite des Verbundes derart, dass beide Werkstoffe gleichzeitig von der gleichen Elektrode kontaktiert werden und somit bei der Bestimmung der Kapazität eine integrale Summenkapazität über beide Komponenten bestimmt wird.

Auf diese Weise konnten unter Verwendung von zwei Bleiperowskitwerkstoffen die in Bild 4.14 und Bild 4.15 gezeigten TKc-Kurven bzw. die  $\Delta C/C_{20^{\circ}C}$ -Kurven erhalten werden.



Bild 4.14: TKc-Kurven einer Mischung aus Komponente 1 und Komponente 2, gemessen in Parallelschaltung



Bild 4.15: △C/C20°C-Kurven einer Mischung aus Komponente 1 und Komponente 2, gemessen in Parallelschaltung (Temperaturbereich: -30°C ... 105°C)

Mit dieser Werkstoffkombination in dieser speziellen Anordnung lag eine Keramik vor, die bei Raumtemperatur über eine Dielektrizitätskonstante von 7.400 verfügte gepaart mit einer Änderung der Kapazität  $\Delta C/C_{20^{\circ}C}$  von -25 % bis 12 % über einen Temperaturbereich von -30°C bis 105°C. Damit lag das Erreichen des reduzierten Projektzieles in realistischer Größe. Gleichzeitig zeigten diese Versuche den weiteren Weg auf, der sich in der Umsetzung der gewonnenen Erkenntnisse in einer für den vorliegenden Anwendungsfall realisierbaren Ausführungsform umsetzen musste.

## 4.1.5 Herstellung von Sprüh- und Wirbelschichtgranulaten

Durch alle bisherigen Ergebnisse zeichnete sich ab, dass die Projektzielstellung nur durch Realisierung eines hohen Anteils von Parallelschaltungen unterschiedlicher Komponenten im Bauteil möglich ist. Da dies aufgrund der Bauteilauslegung nicht durch die Kombination von Folien erfolgen kann, musste nach einem anderen Weg gesucht werden, dieses Funktionsprinzip in einen Filterstecker umzusetzen. Dazu boten sich Granulate an, die von ihrer Primärgröße deutlich über dem Bereich der Reaktionszonen, bedingt durch die Diffusion während der Sinterung, liegen mussten, die aber wiederum auch klein sein mussten im Vergleich zur Dicke des fertigen Planarfilters. Gleichzeitig mussten diese Granulate mechanisch so stabil sein, dass sie nach dem Preßvorgang als Individuen im Grünkörper erhalten bleiben.

Dazu wurde unter Verwendung von PZT-Pulvern als Modellsubstanz eine Entwicklung im IKTS gestartet, die zur Herstellung von mechanisch sehr festen Wirbelschichtgranulaten führte. Diese Granulate wurden in mehreren Fraktionen hergestellt, wie in Bild 4.16 gezeigt, und in dieser Form in Versätze durch Kombination mit Wirbelschichtgranulaten (WS-Granulate) anderer Komponenten eingebracht. Die Größe der Granulate im linken Teil des Bildes liegt im Bereich < 200  $\mu$ m, im mittleren Teil bei 250 – 315  $\mu$ m und im rechten Teil bei 400 – 500  $\mu$ m. Unter Verwendung der PZT-Granulate konnte gezeigt werden, dass selbst die kleinsten Granulate nach dem Pressen im Grünkörper erhalten bleiben und auch nach der Sinterung in der Keramik wieder zu finden sind. Aufbauend auf diesen Resultaten wurden 3 Komponenten auf der Basis komplexer Bleiperowskite mit Curietemperaturen im Bereich von 0°C (K1), 75°C (K2) und 125°C (K3) für die Herstellung von Wirbelschichtgranulaten ausgewählt. Grundvoraussetzung dafür war die Herstellung einer größeren Pulvermenge von mindestens 2 kg.

Die Wirbelschichtgranulate der 3 Verbindungen lagen in 3 Größenfraktionen von beginnend bei 63  $\mu$ m bis > 315  $\mu$ m vor. Damit konnten Versuche zur gezielten Einstellung der Heterogenität durch Variation der Massenanteile der Einzelverbindungen und der Größe der eingesetzten Granulate vorgenommen werden.



Bild 4.16: PZT-WS-Granulate unterschiedlicher Größen



Bild 4.17: Oberfläche einer gesinterten Keramik, hergestellt aus WS-Granulaten unterschiedlicher Komponenten

## 4.1.6 Granulate von Werkstoffen auf Basis komplexer Bleiperowskite

Erste Versuche zeigten sehr schnell, dass nach der Sinterung die Einzelkomponenten im Gefüge gut sichtbar sind. Die dielektrischen Messungen bestätigten das Vorliegen der individuellen Bestandteile in den gesinterten Keramiken, was sich durch das Auftreten mehrerer Maxima in den TKc-Kurven der Keramiken zeigt. Diese Maxima liegen im Bereich der Curietemperaturen der Ausgangskomponenten. Die Kurven in Bild 4.18 und Bild 4.19 verdeutlichen, dass die Verteilung der Komponenten in den Keramiken über die Dicke homogen ist.



Bild 4.18: TKc-Kurven von Keramiken, hergestellt aus WS-Granulaten zweier Komponenten in Abhängigkeit von der Dicke der Keramiken



Bild 4.19: \(\Delta C/C20^\circ C-Kurven von Keramiken, hergestellt aus WS-Granulaten zweier Komponenten in Abhängigkeit von der Dicke der Keramiken \)
Die TKc-Kurven in den beiden folgenden Bildern verdeutlichen sowohl den Einfluss der Sinterbedingungen als auch der Granulatgröße auf die Mischkristallbildung im untersuchten System K1/K3.



Bild 4.20: TKc-Kurven von Keramiken, hergestellt aus Granulaten mit einer Granulatgröße von 160 – 315µm



Bild 4.21: TKc-Kurven von Keramiken, hergestellt aus Granulaten mit einer Granulatgröße von 315 – 500µm

Durch eine deutliche Erhöhung des K1 – Anteils in den Keramiken gelingt es, die Kapazitätsänderung über einen wesentlich größeren Temperaturbereich zu minimieren, wobei gleichzeitig die bei Raumtemperatur gemessene

Kapazität geringer wird. Durch weitere technologische Variationen können Keramiken hergestellt werden, die bei Raumtemperatur über eine Dielektrizitätskonstante von 6.500 verfügen und ein  $\Delta C/C_{20^{\circ}C}$  von  $\pm$  20% über einen Temperaturbereich von -30°C bis 105°C aufweisen.

Gleichzeitig verdeutlichen diese Ergebnisse aber auch, dass die Zielstellung des Projektes mit den ausgewählten Komponenten nicht erfüllbar ist, da die Komponente K1 im negativen Bereich nicht die geforderten Eigenschaften aufweist. Modellrechnungen zeigten, dass dafür eine Verbindung erforderlich ist, die eine Curietemperatur im Bereich von -30°C besitzt gepaart mit einem DK<sub>max</sub> von >15.000. Diese Verbindung war bis zum erreichten Projektstand nicht bekannt und musste durch umfangreiche Literaturauswertung gefunden und experimentell bestätigt werden.

## 4.1.7 Granulate von Werkstoffen auf Basis BaTiO<sub>3</sub>

Neben diesen Granulaten wurden unter dem Gesichtspunkt der Kostenersparnis und der höheren Umweltakzeptanz auch solche auf Basis von BaTiO<sub>3</sub>-Werkstoffen hergestellt und analog verarbeitet.

Als erstes stand die Auswahl der Einzelverbindungen. Aufgrund der steileren Kurvenform wurden 4 Verbindungen ausgewählt, die durch die TKc-Kurven in Bild 4.25 charakterisiert sind. Die individuellen Curietemperaturen liegen bei ca. -30°C; 30°C; 90°C und 125°C und überdecken damit den geforderten Temperaturbereich vollständig.

Die auf diesem Weg realisierte DK beträgt bei Raumtemperatur 5.800 mit einem  $\Delta C/C_{20^{\circ}C}$  von ±20% im Bereich von 0°C bis 90°C.



Bild 4.22: TKc-Kurven von BST 05, BTSZ 101, BTSZ V5 und BaTiO3-Keramiken



Bild 4.23: TKc-Kurven von Keramiken, hergestellt aus BST 05, BTSZ 101 und BTSZ V5 – WS-Granulaten in Abhängigkeit von der Heizrate



Bild 4.24: TKc-Kurven von Keramiken, hergestellt aus BST 05, BTSZ 101 und BTSZ V5 – WS-Granulaten mit anderem Mischungsverhältnis in Abhängigkeit von den Sinterbedingungen

#### 4.1.8 Bleieisentantalat-Keramiken

Die Auswertung der Literatur zu Keramiken auf Basis von Bleieisentantalat mit Curietemperaturen um -30°C verbunden mit DK<sub>20</sub>-Werten >15.000 führte zu Verbindungen auf Basis von Bleieisentantalat (PFT). Die Synthese dieser Verbindungen kann sowohl über eine Totalsynthese als auch über einen zweistufigen Weg unter Bildung von FeTaO<sub>4</sub> erfolgen. Beide Wege wurden untersucht und die Keramiken bezüglich ihrer dielektrischen Eigenschaften charakterisiert.



Bild 4.25: TKc-Kurven von PFT-basierten Keramiken hergestellt über die Totalsynthese, Einfluss der Calcinationstemperatur (linke Zahl) – Sinterung: 2h/1050°C



Bild 4.26: TKc-Kurven von PFT-basierten Keramiken hergestellt über die 2stufige Synthese, Einfluss der Sintertemperatur

Die TKc-Kurven 4.26 in Bild zeigen deutlich den Einfluss der Calcinationstemperatur - linke Zahl im Wertepaar der Legende - auf die dielektrischen Eigenschaften. Der direkte Vergleich zwischen Totalsynthese und zweistufiger Variante bestätigt die an einer Vielzahl von Bleiperowskiten gewonnene Erfahrung, dass die dielektrischen Eigenschaften von Keramiken, hergestellt nach der Totalsynthese z.T. deutlich unter denen der über den zweistufigen Prozess hergestellten liegen. Eine Betrachtung der dielektrischen Verluste zeigt allerdings, dass diese mit steigender Sintertemperatur stark zunehmen und in eine Größenordnung kommen, die für die genannte Entwicklung nicht akzeptabel ist.

Mit den PFT-basierten Keramiken stehen Verbindungen zur Verfügung, die es ermöglichen sollten, heterogene Keramiken mit hohen DK-Werten bei Raumtemperatur gepaart mit einer geringen Änderung der Kapazität über einen weiten Temperaturbereich herzustellen. Im Ergebnis dieser Untersuchungen liegen eine Vielzahl von Kombinationen vor, die bei unterschiedlichen Bedingungen gesintert DK-Werte bei RT von 6.500 bis 7.500 ergeben verbunden mit einer Kapazitätsänderung von  $\Delta C/C_{20^{\circ}C}$  von  $\pm 20\%$  über einen 110°C. Temperaturbereich von -40°C bis Höhere DK-Werte bei Raumtemperatur führen dabei in der Regel zu steileren Kurven und damit zu einem eingeschränkten Temperaturbereich, in dem die Kapazitätsänderung ±20% beträgt.

Mit der Einführung einer weiteren Komponente – als K4 bezeichnet – können Keramiken hergestellt werden, an denen die in den folgenden Abb. gezeigten Kurven gemessen werden.



Bild 4.27: TKc-Kurven von Mischungen aus PFT-basierten Granulaten in Verbindung mit Granulaten zweier anderer Verbindungen in Abhängigkeit von den Sinterbedingungen



Bild 4.28: △C/C20°C-Kurven von Mischungen aus PFT-basierten Granulaten in Verbindung mit Granulaten zweier anderer Verbindungen in Abhängigkeit von den Sinterbedingungen

Damit liegen Werkstoffe vor, die für den Einsatz in Filtersteckverbindern geeignet sind und weit über den bekannten Stand der Technik hinausgehen. Die Überführung der zuletzt gezeigten Ergebnisse in konkrete Filtersteckverbinder steht aus Zeitgründen noch aus.

#### 4.1.9 Reproduktion an Kilogramm-Versätzen

Im Folgenden werden Arbeiten und Ergebnisse dargestellt, die auf als "aussichtsreich" eingeschätzten Versätzen entsprechend der bislang durch IKTS und PI Ceramic erzielten Ergebnisse beruhen und in Mengen von mehreren Kilogramm hergestellt wurden.

Der Übersichtlichkeit halber seien vorab nochmals die Zielparameter des Projektes zusammengefasst:

| Werkstoff   | DK <sub>20</sub> | delta C/C <sub>20</sub> (%) | Temperaturber. (°C) |
|-------------|------------------|-----------------------------|---------------------|
| Anfangsziel | 15.000           | ± 15                        | - 55+ 125           |
| Korrektur   | 7.500            | ± 20                        | - 55+ 125           |

Als unmittelbarer Vergleich zum Stand der Technik dienen der Werkstoff X5 mit X7R-Charakteristik der englischen Firma Ferro sowie verschiedene Werkstoffe der Fa. PI Ceramic.



Bild 4.29: Temperaturgang X7R

| Werkstoffübersicht P | I Ceramic |
|----------------------|-----------|
|                      |           |

| Werkstoff | DK <sub>20</sub> | delta C / C <sub>20°C</sub> [%] | Temperaturbereich |
|-----------|------------------|---------------------------------|-------------------|
| 2C5       | 1.800 -2.000     | ± 20                            | - 55+ 70°C        |
| 2E4       | 4.000 -4.500     | + 20 / - 55                     | - 25+ 85°C        |
| 2E5       | 8.000 -9.000     | + 20 / - 55                     | - 10+ 70°C        |
| 2F5       | 12.000 - 15.000  | + 30 / - 80                     | - 10+ 70°C        |

Je größer der DK<sub>20</sub>-Wert ist, umso steiler sind die Flanken der Temperaturgangkurven.



Temperatur in °C

Bild 4.30: Temperaturgänge der bekannten PI Ceramic-Dielektrika

Die Daten verdeutlichen nochmals die Höhe des Anspruchs des gesteckten Zieles.

## 4.1.10 Lösungsansatz – Bleioxidhaltige Verbindungen

Es wurden folgende Komponenten mit unterschiedlichen Curietemperaturen gemischt mit dem Ziel, im gesinterten Scherben eine Parallelschaltung der Komponenten zu erzeugen. Dazu wird sehr grobes und festes Korn im Grünling benötigt, dessen Korndurchmesser deutlich über den Diffusionswegen der Mischkristallbildung liegen. Derartiges Korn wurde durch die Wirbelschichtgranulierung erhalten.

| Komponenten | DK <sub>20</sub> | Curiepkt. (°C) |
|-------------|------------------|----------------|
| K 1         | 8.000            | - 25           |
| K 2         | 25.000           | + 80           |
| К 3         | 18.000           | + 120          |

Von den o.g. Komponenten wurden je 2 kg Massepulver hergestellt.

Die nachfolgenden Diagramme zeigen die Temperaturgänge der Einzelkomponenten, gemessen an Scheiben.



Bild 4.31: Temperaturgang K1, Masseanmusterung 1.100°C / 2h; Scheibe 10 x 0,5 mm;  $DK_{20}$ =6.200



Bild 4.32: Temperaturgang K2, Masseanmusterung 1100°C / 2h; Scheibe 10 x 0,5 mm; DK<sub>20</sub>=7.200



Temperatur in  $^\circ\mathrm{C}$ 

Bild 4.33: Temperaturgang K3, Masseanmusterung 1100°C / 2h; Scheibe 10 x 0,5 mm; DK<sub>20</sub>=2.200

#### 4.1.11 Lösungsansatz – Bleioxidhaltige Verbindungen

Aus der handgranulierten Masse wurden erste Scheibenmuster hergestellt und die Komponenten als Pulver untereinander vermischt. Bereits diese ersten Ergebnisse sind interessant, da das handgranulierte Pulver schon eine Wirkung der Parallelschaltung zeigte.

| Werkstoff | DK <sub>20</sub> | delta C / C <sub>20</sub> (%) | Temperaturbereich |
|-----------|------------------|-------------------------------|-------------------|
| K 1 + K 2 | 14.800           | + 5 / - 75                    | -30+ 140          |
|           |                  | ± 20                          | 0+ 60             |



Bild 4.34: Temperaturgang K1+ K2, Masseanmusterung 1.100°C / 2h; Scheibe 10 x 0,5 mm; DK<sub>20</sub>=14.800

| Werkstoff | DK <sub>20</sub> | delta C / C <sub>20</sub> (%) | Temperaturbereich |
|-----------|------------------|-------------------------------|-------------------|
| K 1 + K 3 | 9.000            | + 20 / - 40                   | -20+ 140          |
|           |                  | ± 20                          | 0+ 120            |



Temperatur in °C

Bild 4.35: Temperaturgang K1+ K3, Masseanmusterung  $1.100^{\circ}C$  / 2h; Scheibe 10 x 0,5 mm; DK<sub>20</sub> = 9.000

#### 4.1.12 Ergebnisse der Wirbelschichtgranulat-Mischungen

Die Komponenten aus Wirbelschichtgranulat mit der Kornfraktion 160  $\mu$ m – 315  $\mu$ m wurden gemischt, als Scheiben verpresst, gesintert und gemessen.

| Werkstoff | DK <sub>20</sub> | delta C / C <sub>20</sub> (%) | Temperaturbereich |
|-----------|------------------|-------------------------------|-------------------|
| K 1 + K 2 | 12.000           | + 20 / - 50                   | -30+ 130          |
|           |                  | ±20                           | - 5+ 90           |



Temperatur in °C





Bild 4.37 Temperaturgang K1+ K3, DK<sub>20</sub> = 6.700

## **4.1.13** <u>Herstellung und Ergebnisse von Funktionsmustern</u> Werkstoffsystem (K1 + K2), 1200°C, 120<sup>6</sup>

Ergebnisse der Scheibenanmusterung:

| DK <sub>20</sub>          | : 12.000                           |
|---------------------------|------------------------------------|
| tanδ (1 kHz)              | : 22,0 x 10 <sup>-3</sup>          |
| R <sub>is</sub>           | <sub>:</sub> 5 x 10 <sup>9</sup> Ω |
| Delta C / C <sub>20</sub> | : ± 20 %                           |

Temperaturbereich : von - 5 bis + 90 °C

#### 4.1.14 Ergebnisse einer 3-poligen Planarfilter-Ausführung

Aus dem o.g. Werkstoffgemisch wurden Zylinder gepresst und gesintert. Die Pinlöcher wurden per Ultraschall in den Zylinder gebohrt. Anschließend wurden von dem Zylinder 0,50 mm Scheiben getrennt und auf den Scheiben per Siebdruckverfahren die maximal mögliche Elektrodenfläche aufgetragen.

Die Messung der einzelnen Pins ergab folgende Kapazitätswerte:

| <u> Pin – Nr.</u> |         | 1    | 2    | 3    | ÷ |
|-------------------|---------|------|------|------|---|
| Muster 1          | C in pF | 1096 | 1077 | 1135 |   |
| Muster 2          |         | 1127 | 1152 | 1200 |   |
| Muster 3          |         | 1056 | 1053 | 1156 |   |

Up (1 kV / 1') VDC : o.k.

| aü (3,25 MHz) | : 40 dB                   |
|---------------|---------------------------|
| tanδ (1 kHz)  | : 22,0 x 10 <sup>-3</sup> |

Einfügungsdämpfung

| 5 MHz   | 1,9 (1 dB)                                       |
|---------|--|
| 10 MHz  | 4,8 (5 dB)                                       |
| 20 MHz  | 9,3 (9 dB)                                       |
| 50 MHz  | 16,4(16 dB)                                      |
| 100 MHz | 24,4(22 dB) Klammerwerte = Sollwerte für 1300 pF |

Mit einer  $DK_{20}$  = 12.000 wird eine Kapazität von ca. 1100 pF erreicht. Die Dämpfungseigenschaften des Systems entsprechen der Qualität der Planarfilter. Das delta C/C20 von ± 20% bewegt sich im Temperaturbereich von – 5 bis + 90 °C.

#### Werkstoffsystem (K1 + K3) , 1200°C, 120'

Ergebnisse der Scheibenanmusterung:

| : 6.700                  |
|--------------------------|
| : 4,0 x 10 <sup>-3</sup> |
| : 1 x 10 <sup>10</sup> Ω |
|                          |

Delta C / C20 : ± 20 %

Temperaturbereich : von -5 bis +115°C

## 4.1.15 Ergebnisse am 9-poligen Planarfilter

Aus dem Werkstoffgemisch (K1+K3) wurden Blöcke gepresst und gesintert. Anschließend erfolgte der Konturenschnitt (Länge x Breite) und per Ultraschall wurden die Pinlöcher gebohrt. Der gebohrte Block wurde auf 0,50 mm Plattenstärke getrennt und per Siebdruckverfahren die max. Elektrodenfläche auf die Platten aufgetragen.

Die Messung der einzelnen Pins ergab folgende Kapazitätswerte:

| <u> Pin – Nr.</u>  | 1   | 2    | 3    | 4    | 5   | 6    | 7    | 8   | 9   |
|--------------------|-----|------|------|------|-----|------|------|-----|-----|
| Muster 1 / C in pF | 898 | 967  | 1068 | 1066 | 965 | 1033 | 1032 | 995 | 972 |
| Muster 2           | 843 | 1005 | 955  | 935  | 904 | 934  | 1005 | 994 | 964 |
| Muster 3           | 831 | 914  | 902  | 916  | 875 | 882  | 1005 | 906 | 920 |

- Up (1 kV / 1') VDC : o.k.
- aü (2,70 MHz) : 38 dB
- tanδ (1 kHz) : 11,0 x 10<sup>-3</sup>

Einfügungsdämpfung

| 5 MHz   | 1,6 (1 dB)                                      |
|---------|---|
| 10 MHz  | 4,0 (2 dB)                                      |
| 20 MHz  | 8,3 (9 dB)                                      |
| 50 MHz  | 19,4(16 dB)                                     |
| 100 MHz | 20,0(20 dB) Klammerwerte = Sollwerte für 830 pF |

Mit der  $DK_{20}$  = 6.700 wird eine Kapazität von 830 pF realisiert. Die Dämpfungseigenschaften entsprechen ebenfalls der Planarfilterqualität der laufenden Fertigung.

Das delta C/C20 von  $\pm$ 20% bewegt sich im Temperaturbereich von - 5°C bis +115 °C.

#### 4.1.16 Zusammenfassung und Wertung der Ergebnisse

 Die Ergebnisse mit Gemischen aus Wirbelschichtgranulat (Pkt.1.6.5.3.) zeigen deutlich verbesserte Temperaturgänge gegenüber den bisherigen Bariumtitanat-Keramiken.

- (2) Bereits Gemische aus handgranuliertem Pulver zeigen ebenfalls verbesserte Temperaturgangverläufe.
- (3) Standzeiten der Presswerkzeuge für den Einsatz mit Wirbelschichtgranulat sind nicht bekannt.
- (4) Standzeiten der Presswerkzeuge für den Einsatz mit Sprühgranulat sind bekannt.
- (5) Bereits gute Ergebnisse mit handgranuliertem Massepulver lassen vermuten, dass die Werkstoffsysteme als Sprühgranulat ebenfalls positive Ergebnisse zeigen.

#### 4.1.17 Ergebnisse der Sprühgranulatmischungen

Von den Einzelkomponenten K1, K2 und K3 werden je 30 kg Pulver hergestellt und sprühgranuliert. Die Korngrößenfraktion lag zwischen 60 und 80 µm.

Folgende Ergebnisse des Werkstoffsystems K1+K2 an Scheibenmustern wurden ermittelt:

DK<sub>20</sub> : 15.300

tanδ (1 kHz) : 8,0 x 10<sup>-3</sup>

Ris :  $1 \times 10^{11} \Omega$ 

| Werkstoff | DK <sub>20</sub> | delta C / C <sub>20</sub> (%) | Temperaturber. | Schwindung (%) |
|-----------|------------------|-------------------------------|----------------|----------------|
|           |                  | <u> </u>                      | ·              |                |
|           |                  |                               |                |                |
| K 1 + K 2 | 15.300           | + 5 / - 80                    | - 30 + 140     | 18             |
|           |                  | ± 20                          | -10 + 45       |                |



Bild 4.38: Temperaturgang Sprühgranulat K1 + K2; DK20 = 15.300

Folgende Ergebnisse des Werkstoffsystems K1+K3 an Scheibenmustern wurden ermittelt:

DK<sub>2 0</sub> : 7.300 tanδ (1 kHz) : 12,0 x 10  $^{-3}$ Ris : 3 x 10<sup>10</sup> Ω

| Werkstoff | DK <sub>20</sub> | delta C / C <sub>20</sub> (%) | Temperaturber. | Schwindung (%) |
|-----------|------------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| K 1 + K 3 | 7.300            | + 25 / - 50                   | - 30+ 140      | 15             |
|           |                  | + 25 / - 20                   | 0 + 115        |                |



Bild 4.39: Temperaturgang K1+K3, Sprühgranulat, 1200°C, 120', DK20 =7.300

Aus den vorhandenen Sprühgranulatmischungen wurden 25-polige Planarfilter gepresst.

#### Ergebnisse 25-poliger Planarfilter

Menge : 10 Stck.

Charge :  $K1 + K2 (DK_{20} = 15.300)$ 

Paste : Fertigungspaste für Standardtypen

Wandstärke : 0,50 mm

Lange Pinlochreihe: von 1 bis 13

Kurze Pinlochreihe : von 14 bis 25

aü : 38 dB

up (1,0 kV, 1')VDC : o.k.

Einfügungsdämpfung

| 5   | MHz3  | dB |
|-----|-------|----|
| 10  | MHz7  | dB |
| 20  | MHz11 | dB |
| 50  | MHz19 | dB |
| 100 | MHz26 | dB |

Die nachfolgenden Diagramme zeigen die Kapazitätsverteilung innerhalb eines Planarfilters:



Bild 4.40: Kapazitätsverteilung 25-poliger Planarfilter (K1+ K2), Standard-Elektrodenpaste



Bild 4.41: Kapazitätsverteilung 25-poliger Planarfilter (K1+ K2), Elektrodenpaste für HD-Filter

Das zweite Werkstoffsystem K1 + K3 konnte nur im unteren Rohdichtebereich verpresst werden, um auf Grund der geringeren Schwindung von ca. 15 % möglichst maßhaltige Planarfilter zu erhalten. Die Teile waren dadurch sowohl beim Sintern als auch beim Bearbeitungsgang Schleifen sehr bruchanfällig.

| 10 MHz | 4 dB  |
|--------|-------|
| 20 MHz | 8 dB  |
| 50 MHz | 15 dB |

100 MHz.....21 dB



Bild 4.42: Kapazitätsverteilung 25-poliger Planarfilter (K1+ K3), Standardelektrodenpaste

Mit diesem Werkstoffsystem wird eine Kapazität von 830 pF realisierbar.

## 4.1.18 Schlussfolgerungen aus den Ergebnissen

- (1) Das Werkstoffsystem K1+ K2 (Sprühgranulat) bringt einen verbesserten Temperaturgang (von ca. + 20°C) im Bereich delta C / C<sub>20</sub> von ± 20% gegenüber der derzeitig bekannten 2F5-Keramik (Pkt.1.6.5.5.1).
- (2) Das Werkstoffsystem K1+ K3 (Sprühgranulat) bringt einen verbesserten Temperaturgang (von ca. + 50°C) im Bereich delta C/C<sub>20</sub> von ± 20% gegenüber der derzeitig bekannten 2E5-Keramik (Pkt.1.6.5.5.1).
- (3) Die Ergebnisse zeigen auch, dass die o.g. Verbesserungen im Temperaturgangverlauf nur den positiven Temperaturbereich betreffen. Für den negativen Temperaturbereich musste eine weitere Komponente gesucht und erprobt werden.

## 4.1.19 Ergebnisse beim Einsatz von Bleieisentantalat

(Komponente für den negativen Temperaturbereich)

Für die Erprobung von PFT basierten Komponenten wurden folgende Granulate verwendet:

- K2 : Sprühgranulat ( $d_{50} = 80 \mu m$ )
- K3 : Sprühgranulat ( $d_{50} = 60 \mu m$ )
- PFT Basis : Masse(Handgranulat) > 160 μm

Aus den o.g. Komponenten wurden 10g Mischungen hergestellt. Anschließend zur Anmusterung als Scheiben verpresst und gesintert.

PFT-Basis-Ergebnisse der Scheibenmuster (PFT + K2):

DK<sub>20</sub> : 14.900

tanδ (1 kHz) : 250,0 x 10<sup>-3</sup>

Ris :  $2 \times 10^7 \Omega$ 

Up (VDC) : bis 1,6 kV (bei 0,80 mm Scheibenwandstärke)

| Werkstoff | DK <sub>20</sub> | delta  | C / C <sub>20</sub> (%) | Tempera | turber. | Verhältnis |
|-----------|------------------|--------|-------------------------|---------|---------|------------|
| PFT-Basis | + K2             | 14.900 | +/- 20                  | - 15    | + 130   | 65 : 35    |



Bild 4.43: TG\_PFT-Basis + K2, DK20=14.900

Ergebnisse der Scheibenbemuster (PFT-Basis + K2):

| DK <sub>20</sub> | : 16.000                                      |
|------------------|---|
| tanδ (1 kHz)     | : 220,0 x 10 <sup>-3</sup>                    |
| Ris              | : 2 x 10 <sup>7</sup> Ω                       |
| Up (VDC)         | : bis 1,9 kV (bei 1,00 mm Scheibenwandstärke) |

| Werkstoff      | DK <sub>20</sub> | delta C / C <sub>20</sub> (%) | Temperaturber. | Verhältnis |
|----------------|------------------|-------------------------------|----------------|------------|
| PFT-Basis + K2 | 16.000           | ± 20                          | - 20 +130      | 65 : 35    |



Temperatur in "C



Ergebnisse der Scheibenmuster (PFT-Basis+K3):

| DK <sub>20</sub> | : 8.800                                   |
|------------------|---|
| tanδ (1 kHz)     | : 250,0 x 10 <sup>-3</sup>                |
| Ris :            | 2 x 10 <sup>6</sup> Ω                     |
| Up (VDC)         | bis 300V (bei 0,80 mm Scheibenwandstärke) |

| Werkstoff      | DK <sub>20</sub> | <u>delta C / C<sub>20</sub> (%)</u> | Temperaturber. | Verhältnis |
|----------------|------------------|-------------------------------------|----------------|------------|
| PFT-Basis + K3 | 8.800            | ± 20                                | - 20 + 80      | 65 : 35    |



Temperatur in °C

Bild 4.45: TG\_PFT-Basis, DK20=8.800

Ergebnisse der Scheibenmuster (PFT-Basis + K3):

| DK <sub>20</sub> | : 9.300                                     |
|------------------|---|
| tanδ (1 kHz)     | : 210,0 x 10 <sup>-3</sup>                  |
| Ris              | $2 \times 10^{6} \Omega$                    |
| Up (VDC)         | : bis 700V (bei 1,00 mm Scheibenwandstärke) |

| Werkstoff      | DK <sub>20</sub> | delta C / C <sub>20</sub> (%) | Temperaturber. | <u>Verhältnis</u> |
|----------------|------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|
| PFT-Basis + K3 | 9.300            | ± 20                          | - 20 + 80      | 65 : 35           |



Bild 4.46: TG\_PFT –Basis + K3, Scheibe DK20 = 9.300

Zusammenfassung der Anmusterungsergebnisse (PFT Komponente):

Das Gemisch PFT-Basis + K2 bringt eine DK = 16000 und eine Kapazitätsänderung + 20% im Temperaturbereich  $-25^{\circ}$ C bis + 130°C.

Das Gemisch PFT-Basis + K3 bringt eine DK=9300 und eine Kapazitätsänderung <u>+</u> 20% im Temperaturbereich –25 bis +80°C.

Beide Systeme weisen hohe Verlustfaktorwerte, als auch geringe Isolationswerte auf.

Durch den Zusatz von  $MnCO_3$  verbessern sich deutlich der Isolationswiderstand und der Verlustfaktor. Der  $DK_{20}$ -Wert verringert sich jedoch von 14.900 auf 5.900.

## 4.1.20 Aktivitäten und Ergebnisse bleifreier Systemen

Der grundsätzliche Lösungsansatz ist der gleiche wie bei den bleihaltigen Verbindungen.

| Komponenten | Bezeichnung | DK <sub>20</sub> | Curiepkt. (°C) |
|-------------|-------------|------------------|----------------|
| BST – 05    |             | 33.000           | - 30           |
| BTSZ        |             | 48.000           | + 25           |
| BTSZ – V5   |             | 22.000           | + 80           |
| ВТ          |             | 12.000           | +120           |

Je Komponente wurden 2 kg Massepulver hergestellt.

#### Ergebnisse der Masseanmusterung

Gemisch der o.g. Komponenten.

DK<sub>20</sub> : 4.100

Delta C/C<sub>20</sub> : -50 % / +50 %

Temperaturbereich - 30°C bis + 130°

## Ergebnisse der Wirbelschichtgranulierung

Es wurde Wirbelschichtgranulat beim IKTS mit dem Korngrößenbereich von 160  $\mu$ m bis 250  $\mu$ m hergestellt.

| PIC (3-Komponentengemisch) |                           | <b>IKTS</b> (Versuch M6 = optim. Versatz) |                      |  |  |
|----------------------------|---------------------------|---|----------------------|--|--|
| DK <sub>20</sub>           | : 5.300                   | 5500                                      |                      |  |  |
| tanδ (1 kHz)               | : 20,0 x 10 <sup>-3</sup> |   |                      |  |  |
| Ris                        | : 2 x 10 <sup>9</sup> Ω   |   |                      |  |  |
| Delta C/C <sub>20</sub>    | : ±20 %                   | ± 20 %                                    |                      |  |  |
| Temperaturb                | ereich : von +5°C bis +   | 70°C                                      | von +5°C bis + 75 °C |  |  |



Bild 4.47: Kapazitätsänderung 3 Komponentengemisch ( ohne BT) – Wirbelschichtgranulat

Die Funktionsmusterherstellung (3-polige Ausführung) aus Wirbelschichtgranulat erfolgte nach optimaler Mischkombination M6. Realisierung von 500 pF mit max. Elektrodenfläche und einer Wandstärke von 0,40 mm.

System: CaCu<sub>3</sub>Ti<sub>4</sub>O<sub>12</sub> (CCT) Keramiken der Zusammensetzung CaCu<sub>3</sub>Ti<sub>4</sub>O<sub>12</sub> (CCT) weisen neben einer hohen DK20 auch einen günstigen Temperaturgang der Kapazität auf, der in Richtung X7R – Charakteristik geht.

# 4.2 Aus der Zusammenarbeit CONEC und Universität GH Paderborn bzw FH-SWF

Die Zusammenarbeit betraf im Wesentlichen die Modellierung von Filtersteckverbindern, sowie Messtechnische Fragen.

## 4.2.1 Grundprinzip eines Filtersteckverbinders am Beispiel eines C-Filters

Bild 4.48 zeigt das Prinzip eines Filters. Ein Störsignal wird einem Nutzsignal überlagert. Die Aufgabe des Filters besteht darin, das Störsignal zu vernichten und trotzdem das Nutzsignal in einem akzeptablen Rahmen zu übertragen, d.h. dass es noch von einem elektronischen System z.B. als digitales Signal erkannt werden kann.



Bild 4.48: Grundfunktion eines Filtersteckverbinders.

Der theoretische Frequenzgang ergibt sich aus Bild 4.49. Demgegenüber zeigt Bild 4.50 den gemessenen Frequenzgang eines realen C-Filters. Es kommt dabei zu starken Resonanzeffekten.

Bild 4.51 zeigt die Übersprechdämpfung. Bild 4.52 zeigt die Abhängigkeit der Kapazität von der Frequenz im unteren Frequenzbereich.



Bild 4.49: Theoretischer Frequenzgang der Einfügungsdämpfung eines C-Filters mit einem idealen Kondensator



Bild 4.50: Realer Frequenzgang der Einfügungsdämpfung eines C-Filters

#### Filtertechnologien



Bild 4.51: Übersprechdämpfung eines C-Filters



Bild 4.52: Kapazität eines C-Filters in Abhängigkeit von der Frequenz.

## 4.2.2 Vergleich verschiedener Technologien

Ein Vergleich der am Markt etablierten Technologien ist in Bild 4.53 bis Bild 4.55 dargestellt.

|                        | Kapa <sub>zität in</sub><br>pr | Ud DC | <sup>a</sup> E in dB bei 1<br>GH <sub>2</sub> | <sup>d</sup> Ü dB (bester<br>Wert 0.1GH | dC/C in % (<br>50+1000G 4<br>Celsius) | dC/C=f(f) bis 1<br>MHz in % | Preislevel |
|------------------------|--------------------------------|-------|---|---|---------------------------------------|-----------------------------|------------|
| Planare Multilayer USA | 5000                           | 700   | 45  | 40                                      | 20                                    | 8                           | 50         |
| Gen1 Taiwan            | 1300                           | 300   | 40  | 50                                      | 20                                    | 8,5                         | 30         |
| Gen2 PI Ceramic        | 1300                           | 1500  | 30  | 6                                       | 50                                    | 9                           | 10         |
| Gen3 PI Ceramic        | 1300                           | 1000  | 37,5  | 40                                      | 40                                    | 10                          | 20         |
| Gen X                  | 2500                           | 1000  | 35  | 55                                      | 15                                    | 8,4                         | 15         |
| Chip                   | 2000                           | 100   | 12,5  | 20                                      | 20                                    | 6,5                         | 15         |
| Röhrchen               | 2000                           | 300   | 30  | 50                                      | 20                                    | 5,7                         | 30         |
| Marktanforderungen für | 1300                           | 1000  | 40  | 40                                      | 10                                    | 10                          | 10         |

#### Bild 4.53: Vergleich verschiedener Technologien



Bild 4.54: Verschiedene Technologien im Vergleich



Bild 4.55: Verschiedene Technologien im Vergleich

## 4.2.3 Realer Kondensator mit einem Dielektrikum hoher Dielektrizitätszahl

Die folgenden Ausführungen betreffen das Verhalten eines realen Kondensators.

Ein Kondensator wird in Bild 4.56 als koaxiale Leitung modelliert mit dem Ziel, den Einfluss eines Dielektrikums mit sehr hoher Dielektrizitätszahl darzustellen. Bild 4.57 zeigt das prinzipielle Verhalten eines Kondensators, der als koaxiale Leitung modelliert wird. Ab der oberen Grenzfrequenz fo beginnt der Kondensator zu resonieren, da es aufgrund des geringen Wellenwiderstandes der koaxialen Leitung am Eingang und Ausgang der Leitung des Kondensators zu Fehlanpassungen kommt. Als Konsequenz daraus muss der Kondensator in seiner axialen Ausdehnung möglichst klein gehalten werden, was andererseits wiederum mit einer kleinen Kapazität verbunden ist, was man nicht möchte. Verringert man dann aber die Abstände, um die Kapazität wieder auszugleichen, verliert man die Spannungsfestigkeit.

Zur weiteren Untersuchung wurden daher einige Varianten durchgerechnet, die in Bild 4.58 dargestellt sind. Die Ergebnisse der simulierten Varianten zeigt Bild 4.59. Eine Vergrößerung der Dielektrizitätszahl verringert die obere Grenzfrequenz, d.h. der Kondensator kann höhere Frequenzen als fo nicht mehr optimal dämpfen.


Bild 4.56: Modellierung eines elektrisch langen Kondensators als Koaxialleitung



Bild 4.57: Frequenzgang der Einfügungsdämpfung eines realen Kondensators

| ٤r    | Z    | v     | Т    | C=C* I | f <sub>U</sub> | f <sub>o</sub> | f      |
|-------|------|-------|------|--------|----------------|----------------|--------|
|       | Ohm  | mm/ns | ns   | nF     | MHz            | MHz            | MHz    |
| 1000  | 1,73 | 9,49  | 1,05 | 0,61   | 10,42          | 237,17         | 118,59 |
| 2000  | 1,22 | 6,71  | 1,49 | 1,22   | 5,21           | 167,71         | 83,85  |
| 3000  | 1,00 | 5,48  | 1,83 | 1,83   | 3,47           | 136,93         | 68,47  |
| 4000  | 0,86 | 4,74  | 2,11 | 2,44   | 2,61           | 118,59         | 59,29  |
| 5000  | 0,77 | 4,24  | 2,36 | 3,06   | 2,08           | 106,07         | 53,03  |
| 6000  | 0,70 | 3,87  | 2,58 | 3,67   | 1,74           | 96,82          | 48,41  |
| 7000  | 0,65 | 3,59  | 2,79 | 4,28   | 1,49           | 89,64          | 44,82  |
| 8000  | 0,61 | 3,35  | 2,98 | 4,89   | 1,30           | 83,85          | 41,93  |
| 9000  | 0,58 | 3,16  | 3,16 | 5,50   | 1,16           | 79,06          | 39,53  |
| 10000 | 0,55 | 3,00  | 3,33 | 6,11   | 1,04           | 75,00          | 37,50  |
| 11000 | 0,52 | 2,86  | 3,50 | 6,72   | 0,95           | 71,51          | 35,75  |
| 12000 | 0,50 | 2,74  | 3,65 | 7,33   | 0,87           | 68,47          | 34,23  |
| 13000 | 0,48 | 2,63  | 3,80 | 7,94   | 0,80           | 65,78          | 32,89  |
| 14000 | 0,46 | 2,54  | 3,94 | 8,55   | 0,74           | 63,39          | 31,69  |
| 15000 | 0,45 | 2,45  | 4,08 | 9,17   | 0,69           | 61,24          | 30,62  |
| 16000 | 0,43 | 2,37  | 4,22 | 9,78   | 0,65           | 59,29          | 29,65  |
| 17000 | 0,42 | 2,30  | 4,35 | 10,39  | 0,61           | 57,52          | 28,76  |
| 18000 | 0,41 | 2,24  | 4,47 | 11,00  | 0,58           | 55,90          | 27,95  |
| 19000 | 0,40 | 2,18  | 4,59 | 11,61  | 0,55           | 54,41          | 27,21  |
| 20000 | 0,39 | 2,12  | 4,71 | 12,22  | 0,52           | 53,03          | 26,52  |

ε<sub>r</sub>: Dielektrizitätszahl des Dielektrikums

Z: Wellenwiderstand der Leitung

v: Ausbreitungsgeschwindigkeit

T: Laufzeit

C=C\*I : Kapazität des Kondensators

f<sub>U</sub> :Untere Grenzfrequenz (3dB)

 $\mathbf{f}_{\mathbf{0}}$  :Obere Grenzfrequenz

f :Abstand der Nullstellen

$$f_U = \frac{1}{\pi C Z_M}$$
$$f_o = \frac{1}{4T}$$
$$f = \frac{1}{2T}$$

Bild 4.58: Einfluss der Dielektrizitätszahl auf die Einfügungsdämpfung



Von oben nach unten :

ε<sub>r</sub> =1000, 5000, 10000, 15000;

C= 0,61 nF, 3,06nF, 6,11nF, 9,17 nF.

Die fetten Linien geben den Frequenzgang der Einfügungsdämpfung für einen el. Iangen Kondensator an.

Die dünne Linie gibt den Frequenzgang der Einfügungsdämpfung für einen idealen Kondensator an.

Bild 4.59: Simulation der Einfügungsdämpfung eines Filtersteckverbinders

### 4.2.4 Ansätze zur Verbesserung des Hochfrequenzverhaltens

Bei Kondensatoren, die mit Dielektrika mit hohen Dielektrizitätszahlen hergestellt werden, fällt die Einfügungsdämpfung bei hohen Frequenzen im Bereich einiger 100 MHz bis GHz wieder ab. Zur Lösung dieses Problems wurden Ansätze durchgeführt, die im Folgenden beschrieben sind.

Die folgende Untersuchung zeigt prinzipiell einen Weg auf, wie die stehenden Wellen in ihrer Wirkung abgeschwächt werden können. Dazu wird gemäß Bild 4.60 der zylindrische Kondensator in 4 Leitungsabschnitte aufgeteilt.

Eine elektrische Ersatzschaltung zeigt Bild 4.61. Die mit einer solchen Schaltung zu erzielende Einfügungsdämpfung zeigt *Bild 4.62*. Gegenüber einem nicht unterteilten Kondensator erhält man eine Verbesserung der Einfügungsdämpfung. Dabei wird die Dämpfung größer und die Resonanzen verschieben sich hin zu höheren Frequenzen.

Eine Begrenzung der Resonanzen kann durch die Beschaltung der Leitungsabschnitte mit dem Wellenwiderstand der Leitungsabschnitte erreicht werden. Eine Beschaltung zwischen Signalleiter und Masse kommt nicht in Frage, da die Impedanz des Filters dadurch unzulässig klein würde. Daher kommt nur die in Bild 4.63 dargestellte Beschaltung in Frage, deren Wirksamkeit in Bild 4. dargestellt ist. Man erkennt die weniger ausgeprägten Resonanzen im oberen Frequenzbereich, die hier im Gegensatz zu Bild 4. statt -200 dB nur noch etwa 50 dB betragen.



*Bild* 4.60: Schnitt durch einen einzelnen zylindrischen Kondensator eines Filtersteckverbinders mit mehrfacher Unterteilung in z.B. hier dargestellte 4 einzelne Leitungsabschnitte.

Oben: Die Innenelektrode des Kondensators ist in 4 Leitungsabschnitte unterteilt und in der Mitte der Leitungsabschnitte kontaktiert.

Unten: Die Außenelektrode des Kondensators ist in 4 gleiche Leitungsabschnitte unterteilt und in der Mitte kontaktiert.



Bild 4.61: Oben: Modellierung für einen Kondensator gemäß Bild 1.1.2.1.1 mit den Daten  $\varepsilon_r$  = 1000 C=0,61 nF,

Länge eines Leitungsabschnitts = 2,5 mm , Laufzeit eines Abschnitts =262 ps. Da dieser Abschnitt in der Mitte kontaktiert ist, vergl. Bild 1.1.2.1.1, wird die Leitung halbiert und parallel geschaltet. Wellenwiderstand der Leitungsabschnitte = 1,73 Ohm

Laufzeit der Verbindung (1 mm angenommen) zwischen zwei Leitungsabschnitten = 3,3 ps.

Unten: Schaltung ohne Unterteilung in Leitungsabschnitte.



Bild 4.62: Resultat der Berechnung für den Frequenzgang der Einfügungsdämpfung für einen Kondensator mit 4-fach unterteilten Leitungsabschnitten gemäß Bild 4.61 im Vergleich zu einem Kondensator ohne Unterteilung der Leitungsabschnitte im Bereich 100 MHz bis 10 GHz.



#### Bild 4.63: Modellierung für einen Kondensator mit den Daten

 $\varepsilon_r = 1000 \text{ C}=0,61 \text{ nF}$ , Länge eines Leitungsabschnitts = 2,5 mm, Laufzeit eines Abschnitts =262 ps. Da dieser Abschnitt in der Mitte kontaktiert ist, wird die Leitung halbiert und parallel geschaltet. Wellenwiderstand der Leitungsabschnitte = 1,73 Ohm

Laufzeit der Verbindung (1 mm angenommen) zwischen zwei Leitungsabschnitten = 3,3 ps. R7-R10 Beschaltungswiderstände



Bild 4.64: Resultat der Berechnung für den Frequenzgang der Einfügungsdämpfung für einen Kondensator mit 4-fach unterteilten und mit dem Wellenwiderstand beschalteten Leitungsabschnitten gemäß Bild 4.63 im Vergleich zu einem Kondensator ohne Unterteilung der Leitungsabschnitte im Frequenzbereich bis 1 GHz.

# 4.3 Ergebnisse aus der Entwicklung bei der Fa CONEC

### 4.3.1 Übersicht der Prüfungen

Um eine erste Aussage über das Verhalten des neuen Materials im Steckverbinder bewerten zu können wurden die folgenden Prüfungen durchgeführt.

### 4.3.1.1 Kapazität und Verlustfaktor

Die Kapazität und der Verlustfaktor wurden innerhalb des Temperaturbereichs – 60°C bis 155°C bewertet.

### 4.3.1.2 Isolationswiderstand

Der Isolationswiderstand wurde bei Raumtemperatur mit 100V DC bewertet.

### 4.3.1.3 Einfügungsdämpfung

Die Einfügungsdämpfung wird nach dem MIL Standard 220 gemessen und stellt das logarithmische Verhältnis der Pegel mit und ohne Filter dar. Gemessen wird in einem 500HM Messsystem. Bild 4.65 zeigt den Messaufbau.



Bild 4.65: Aufbau eines Messplatzes für die Messung der Einfügungsdämpfung und der Übersprechdämpfung

# 4.3.1.4 Übersprechen/Crosstalk

Die Einfügungsdämpfung wird nach dem MIL Standard 220 gemessen und stellt das logarithmische Verhältnis der Pegel mit und ohne Filter dar. Gemessen wird in einem 50 OHM Messsystem.

4.3.1.5 Spannungsfestigkeit

Die Spannungsfestigkeit wird mit den folgenden Parametern ermittelt:

Anstiegsgeschwindigkeit : 200V/s

Haltezeit : 60s

### 4.3.1.6 Steckzyklen

Die Steckzyklen werden ermittelt, um die mechanische Stabilität im Einsatz des Steckverbinders zu simulieren. Danach wird eine Überprüfung der Kapazität, des Verlustfaktors und der Spannungsfestigkeit vorgenommen.

# 4.3.2 Übersicht Proben

Getestete Materialien

| Probenbezeichnung | Werkstoffsystem                                       | Bemerkung                       |
|-------------------|---|---------------------------------|
| K1 + K2           | PMN – C1 / PMN – PNN – PT<br>(K1 + K2) , 1200°C, 120' | Standard Elektroden<br>Material |
| K1 + K2           | PMN – C1 / PMN – PNN – PT<br>(K1 + K2) , 1200°C, 120' | HD Elektroden Material          |
| K1 + K3           | C1 / PMN – PT- 7525 (K1 +<br>K3) , 1200°C, 120'       |                                 |

## 4.3.3 Ergebnisse

| 4.3.3.1 | K1+K2 |          |
|---------|-------|----------|
| DK20    |       | : 15.300 |

Die Bemusterung dieses Werkstoffsystem wurde mit zwei verschiedenen Elektrodenmaterialien durchgeführt, die im Folgenden mit Standard D-SUB und HD-SUB bezeichnet werden.











Der Temperaturverlauf stellt sich wie bei den Ergebnissen von PI Ceramic dar. Der Temperaturbereich für eine Abweichung von ±20% liegt zwischen -10°C bis +40°C. Damit hat sich nahezu der gleiche Temperaturbereich wie bei den Messungen an den Proben der Planarfilterplatten ergeben.



Bild 4.68: Einfügungsdämpfung und Crosstalk

Der Verlauf der Einfügungsdämpfung entspricht den Anforderungen der Industrie für diesen Kapazitätswert. Beim ermittelten Crosstalk kann von keiner Beeinflussung der benachbarten Signalkontakte ausgegangen werden.

| 4.3.3.1.1.1 | Spannungsfestigkeit |
|-------------|---------------------|
|-------------|---------------------|

| Prüfling  | 710V DC   | 1500V DC          |
|---|-----------|-------------------|
| K1+K2 (Fertigungspaste für Standardtypen) Prüfling1 | bestanden | Ausfall bei 1240V |
| K1+K2 (Fertigungspaste für Standardtypen) Prüfling2 | bestanden | Bestanden         |
| K1+K2 (Fertigungspaste für Standardtypen) Prüfling3 | bestanden | Ausfall bei 1190V |
| K1+K2 (Fertigungspaste für Standardtypen) Prüfling4 | bestanden | Bestanden         |
| K1+K2 (Fertigungspaste für Standardtypen) Prüfling5 | bestanden | Ausfall bei 1130V |
| K1+K2 (Fertigungspaste für Standardtypen) Prüfling6 | bestanden | Ausfall bei 1450V |
| K1+K2 (Fertigungspaste für Standardtypen) Prüfling7 | bestanden | Ausfall bei 1450V |
| K1+K2 (Fertigungspaste für Standardtypen) Prüfling8 | bestanden | Bestanden         |
| K1+K2 (Fertigungspaste für Standardtypen) Prüfling9 | bestanden | Ausfall bei 800V  |
| K1+K2 (Fertigungspaste für Standardtypen)           |           |                   |
| Prüfling10  | bestanden | Bestanden         |

#### 4.3.3.1.2 Elektrodenmaterial HD-SUB

Bei den Mustern mit dem Elektrodenmaterial HD-SUB konnten ein Kapazitätszuwachs von ca. 300pF gegenüber dem Standard D\_SUB Elektrodenmaterial ermittelt werden. Dies hängt mit damit zusammen, dass die Basis der Druckpaste besser mit der Keramik harmonisiert.

Ansonsten haben sich die Ergebnisse gegenüber dem Elektrodenmaterial Standard D-SUB nicht verändert.













#### 4.3.3.1.2.2 Spannungsfestigkeit

| Prüfling                                  | 710V DC   | 1500V DC          |
|---|-----------|-------------------|
| K1+K2 (Fertigungspaste für HD) Prüfling1  | bestanden | Ausfall bei 580V  |
| K1+K2 (Fertigungspaste für HD) Prüfling2  | bestanden | Ausfall bei 1240V |
| K1+K2 (Fertigungspaste für HD) Prüfling3  | bestanden | Ausfall bei 1230V |
| K1+K2 (Fertigungspaste für HD) Prüfling4  | bestanden | Ausfall bei 705V  |
| K1+K2 (Fertigungspaste für HD) Prüfling5  | bestanden | Ausfall bei 810V  |
| K1+K2 (Fertigungspaste für HD) Prüfling6  | bestanden | Ausfall bei 1480V |
| K1+K2 (Fertigungspaste für HD) Prüfling7  | bestanden | bestanden         |
| K1+K2 (Fertigungspaste für HD) Prüfling8  | bestanden | Ausfall bei 810V  |
| K1+K2 (Fertigungspaste für HD) Prüfling9  | bestanden | Ausfall bei 1030V |
| K1+K2 (Fertigungspaste für HD) Prüfling10 | bestanden | Ausfall bei 1010V |

4.3.3.2 K1+K3 DK<sub>20</sub> : 7300

Der Temperaturverlauf der Kapazität hat bei diesem Werkstoffsystem keinen extremen Abfall unter 0°C und oberhalb 50°C gezeigt. Bei Temperaturen oberhalb 50°C steigt die Kapazität um bis zu 40% gegenüber dem Wert bei 20°C. Dieser große Anstieg wurde nicht bei den Ergebnissen von PI Ceramic festgestellt.

Kapazität

Bild 4.71 und Bild 4.72 zeigen die Abhängigkeit der Kapazität von der Temperatur.



Bild 4.71: C(T)



#### 4.3.3.2.1 Verlustfaktor



4.3.3.2.2 Isolationswiderstand



Bild 4.74: Isolationswiderstand  $R_{l}(T)$ 



Bild 4.75: R<sub>1</sub>(T)/R<sub>1</sub>(T<sub>20°C</sub>)

# 4.3.3.2.3 Einfügungsdämpfung / Crosstalk



Bild 4.76: Einfügungsdämpfung und Crosstalk

| Prüfling          | 710V DC   | 1500V DC          |
|-------------------|-----------|-------------------|
| K1+K3 Prüfling 1  | bestanden | Ausfall bei 1040V |
| K1+K3 Prüfling 2  | bestanden | Ausfall bei 1010V |
| K1+K3 Prüfling 3  | bestanden | Ausfall bei 820V  |
| K1+K3 Prüfling 4  | bestanden | Ausfall bei 820V  |
| K1+K3 Prüfling 5  | bestanden | Ausfall bei 1020V |
| K1+K3 Prüfling 6  | bestanden | Ausfall bei 1040V |
| K1+K3 Prüfling 7  | bestanden | Ausfall bei 820V  |
| K1+K3 Prüfling 8  | bestanden | Ausfall bei 1040V |
| K1+K3 Prüfling 9  | bestanden | Ausfall bei 1240V |
| K1+K3 Prüfling 10 | bestanden | Ausfall bei 1040V |

Die Spannungsfestigkeit wurde an unlackierten Prüflingen durchgeführt. Eine Bewertung mit einem Schutzlacküberzug brachte eine sichere Spannungsfestigkeit bei 1500VDC.

# 4.3.4 Zusammenfassung der Ergebnisse

Die Planarfilterplatten, hergestellt mit den Werkstoffsystem K1 + K2 und K1 + K3, wurden nach der im vorigen Abschnitt darstellten Vorprüfung einem umfangreichen Produktqualifikationstest nach unten aufgestelltem Plan durchgeführt. Beide Werkstoffe erfüllen die mechanischen und elektrischen Anforderungen für die aktuellen Conec-Produkte.

# 4 Erzielte Ergebnisse

| Sequence a   | Sequence b   | Sequence c   | Sequence d   | Sequence e  | Sequence   | <u>ce f</u>  |
|--|--|--|--|---|--|--|
| Visual/ Mechanical<br>Examination  | Visual / Mechanical<br>Examination   | Visual / Mechanical<br>Examination   | Visual / Mechanical<br>Examination   | Visual / Mechanical<br>Examination  | Visual / Mechanical<br>Examination   | Contact Resistance   |
| Examination<br>Contact Resistance<br>Mating / Unmating<br>Force<br>Durability<br>Contact Resistance<br>Gas Tightness (Sn, Ag<br>only)<br>Wear Track (Au, Pd<br>only) | Examination<br>Contact Resistance<br>Insulation Resistance<br>Dielectric Withstanding<br>Voltage<br>Capacitance<br>Dissipation Factor<br>Vibration<br>Contact Resistance<br>Insulation Resistance<br>Dielectric Withstanding<br>Voltage<br>Capacitance<br>Dissipation Factor<br>Mechanical Shock<br>Contact Resistance<br>Insulation Resistance<br>Insulation Resistance<br>Dielectric Withstanding<br>Voltage<br>Capacitance<br>Dielectric Withstanding<br>Voltage<br>Capacitance<br>Dissipation Factor | Examination<br>Mating / Unmating Force<br>Contact Resistance<br>Insulation Resistance<br>Dielectric Withstanding<br>Voltage<br>Capacitance<br>Dissipation Factor<br>Thermal Shock<br>Contact Resistance<br>Insulation Resistance<br>Dielectric Withstanding<br>Voltage<br>Capacitance<br>Dissipation Factor<br>Moisture Resistance<br>Mating / Unmating Force<br>Contact Resistance<br>Insulation Resistance<br>Insulation Resistance<br>Dielectric Withstanding<br>Voltage<br>Capacitance | Examination<br>Contact Resistance<br>Insulation Resistance<br>Dielectric Withstanding<br>Voltage<br>Capacitance<br>Dissipation Factor<br>Insertion Loss<br>Thermal Aging<br>Filtered Ground<br>Integrity<br>Contact Resistance<br>Insulation Resistance<br>Dielectric Withstanding<br>Voltage<br>Capacitance<br>Dissipation Factor<br>Insertion Loss<br>Electrical Surge | Examination<br>Cable Termination<br>Resistance<br>Themal Aging<br>Termination Gas<br>Tightness<br>Cable Termination<br>Resistance | Examination<br>Cable Flexing<br>Strain Relief Integrity<br>Termination Gas Tightness<br>Sequence i<br>Visual / Mechanical<br>Examination<br>Contact Resistance<br>Insulation Resistance<br>Dielectric Withstanding<br>Voltage<br>Capacitance<br>Dissipation Factor<br>Insertion Loss<br>Durability<br>Mixed Flowing Gas<br>Contact Resistance<br>Mixed Flowing Gas<br>Contact Resistance<br>Mixed Flowing Gas<br>Contact Resistance<br>Mixed Flowing Gas | Durability<br>Contact Resistance<br>Insulation<br>Resistance<br>Dielectric<br>Withstanding<br>Voltage<br>Capacitance<br>Dissipation Factor<br>Insertion Loss |
|  |  | Dissipation Factor   |  |   |  |  |

Tabelle 4.3: Qualifikationsprogramm



#### 4.3.4.1 Wekkstoffsystem K1+K2

Bild 4.77: Vergleich zwischen K1+K2 und 2F5

In Bild 4.77 ist die auf 20°C normierte Temperaturabhängigkeit der Kapazität für das in diesem Vorhaben entwickelte Werkstoffsystem K1 + K2 und das bereits existierende Werkstoffsystem 2F5 dargestellt. Bei fast gleichen Dielektrizitätskonstanten konnte eine erheblich verbesserte Temperaturstabilität hergestellt werden. Der Curiepunkt des Werkstoffsystems liegt bei 20°C und die Steigungsraten ober- und unterhalb des Curiepunktes sind gegenüber des Werkstoffsystems 2F5 stark reduziert worden wie in Bild 2 dargestellt ist. Der - 20%- Punkt konnte von 10°C auf -10°C verschoben werden.

Der Verlustfaktor liegt mit 8\*10<sup>-3</sup> unter dem geforderten Minimumwert.

Die HF Eigenschaften dieses Werkstoffsystems zeigen in dem untersuchten Frequenzbereich keinerlei Abweichungen zum bekannten System 2F5.

Die Spannungsfestigkeit wurde an unlackierten Mustern durchgeführt und zeigte eine mindesten eine Spannungsfestigkeit von 1kV bei 0,4mm Materialstärke. Die Mindestdurchschlagsfeldstärke, welche momentan mit 2,5kV pro mm spezifiziert wurde muss noch weiter optimiert werden, liegt aber jetzt schon im Bereich der Masse 2F5, die Ihrerseits im Bereich von 3kV pro mm liegt.

Mit den heutigen Ergebnissen kann gesagt werden, dass das Werkstoffsystem K1 + K2 eine Verbesserung gegenüber des Werkstoffsystems 2F5 ist und somit in nächster Zukunft in den Planarfilterplatten der Firma PI Cermic verwendet und in die Endprodukte der Firma Conec integriert werden.



Bild 4.78: Steigung für C(T)

## 4.3.4.2 Werkstoffsystem K1+K3

Beim Werkstoffsystem K1 + K3 wurde eine Dielektrizitätskonstante von 7300 für das Sprühgranulat ermittelt. Bei den Probanden, hergestellt mittels Wirbelschichtgranulat, wurde eine Dk von 6700 ermittelt. Da die Schwindung bei diesen Werkstoffsystem nicht mit den Vorgaben der existierenden Werkzeugen übereinstimmte, musste die Sinterdichte verändert werden, um mit den Serienwerkzeugen maßhaltige Planarfilterplatten herzustellen. Daraus ergibt sich die starke DK-Anhebung im Temperaturbereich oberhalb 40°C. Um die Wirbelschichtgranulat von dem bekannten und besseren Temperaturverläufe zu erreichen, müsste die Sinterdichte wieder erhöht werden, dies hätte eine Korrektur der Presswerkzeuge zur Folge. Aufgrund der ermittelten und in Bild 4.79 dargestellten Ergebnisse, wurde mit dem Werkstoffsystem K1 + K3 der größte Schritt zum erreichen des Projektzieles dem Werkstoffsystem wurde komplette gemacht. Mit der positive Temperaturbereich in den Bereich ±20% gelegt. Wie schon in den Ausführungen von PI Ceramic vermerkt, müsste für den negativen Temperaturbereich noch eine Komponente hinzugefügt werden, die eine Anhebung der DK um ca. 30% realisiert. Es kann aber trotzdem gesagt werden, dass ein solches Werkstoffsystem nicht am Markt verfügbar ist. Dieses Material kann mit Sicherheit in einem großen Bereich in der Industrie eingesetzt werden.



Bild 4.79: Vergleich zwischen K1 + K3 und 2E5

Der Verlustfaktor liegt mit 12\*10<sup>-3</sup> unter dem geforderten Minimumwert. Bei diesen Mustern wurde ebenfalls eine Messung des Verlustfaktors über den Temperaturbereich durchgeführt, der Verlustfaktor liegt über den gesamten Temperaturbereich unterhalb des geforderten Wertes.

Die HF-Eigenschaften dieses Werkstoffsystems zeigen in dem Untersuchten Frequenzbereich keinerlei Abweichungen zum bekannten System 2E5.

Die Spannungsfestigkeit wurde an unlackierten Mustern durchgeführt und zeigte eine mindesten eine Spannungsfestigkeit von 1kV bei 0,4mm Materialstärke. Die Mindestdurchschlagsfeldstärke, welche momentan mit 2,5kV pro mm spezifiziert wurde muss noch weiter optimiert werden, liegt aber jetzt schon im Bereich der Masse 2F5, die ihrerseits im Bereich von 3kV pro mm liegt.

### 5 Veröffentlichungen

J. Meppelink, J.Kühle: EINSATZVERHALTEN VON FILTERSTECKVERBINDERN 8. Energietechnisches Forum der Fachhochschule Kiel 2001

Erste Wing Konferenz 29.-31.Oktober 2003 in Weimar.:

Gemeinsames Poster Intelligente Steckverbinder mit integrierten, temperaturstabilen hochdielektrischen Keramikfiltern als Interface in Kommunikationsnetzen. Förderkennzeichen 03N1072

Dr. Falko Schlenkrich; Dr. Andreas Schönecker Entwicklung temperaturstabiler hochdielektrischer Werkstoffe für Filtersteckverbinder. Jahresbericht IKTS 2003